



UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE ATIVIDADES  
ACADÊMICAS



EMITIDO EM 29/02/2024 09:42

## RESUMO DO COMPONENTE CURRICULAR

### Dados Gerais do Componente Curricular

<b>Tipo do Componente Curricular:</b>	DISCIPLINA
<b>Unidade Responsável:</b>	PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA INDUSTRIAL (PEI) (12.01.23.28)
<b>Código:</b>	PEI0084
<b>Nome:</b>	FUNDAMENTOS DE FLUORESCÊNCIA E DIFRAÇÃO DE RAIOS X
<b>Carga Horária Teórica:</b>	30 h.
<b>Carga Horária Prática:</b>	0 h.
<b>Carga Horária Total:</b>	30 h.
<b>Excluir da Avaliação Institucional:</b>	Não
<b>Matriculável On-Line:</b>	Sim
<b>Horário Flexível da Turma:</b>	Sim
<b>Horário Flexível do Docente:</b>	Sim
<b>Obrigatoriedade de Conceito:</b>	Sim
<b>Pode Criar Turma Sem Solicitação:</b>	Sim
<b>Necessita de Orientador:</b>	Não
<b>Exige Horário:</b>	Sim
<b>Permite CH Compartilhada:</b>	Não
<b>Permite Múltiplas Aprovações:</b>	Não
<b>Quantidade de Avaliações:</b>	1
<b>Módulo:</b>	
<b>Ementa/Descrição:</b>	Fluorescência. Fundamentos de cristalografia. Produção, Propriedades e detecção dos raios X. Difração de Raios X. Lei dos Braggs. Difração em Monocristais. Difração em Materiais Policristalinos, método do pó. O difratômetro de raios X. Intensidade dos feixes de raios X difratados. Principais aplicações da difração de raios X na caracterização de materiais. Breve introdução ao método de refinamento de Rietveld.

Marcio André Fernandes Martins  
Coordenador Geral do PEI  
SIAPE Nº: 2042153  
Escola Politécnica/UFBA

### Referências:

#### HISTÓRICO DE EQUIVALÊNCIAS

Expressão de Equivalência	Ativa	Início da Vigência	Fim da Vigência
( ENGN24/20181 )	ATIVO	24/11/2022	